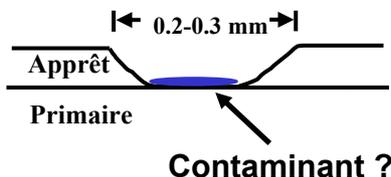
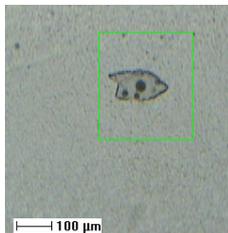


Fiche d'application n° 1

Caractérisation d'un refus d'adhérence peinture

Objet : Refus de mouillage d'un apprêt sur un primaire se traduisant par la formation d'un cratère

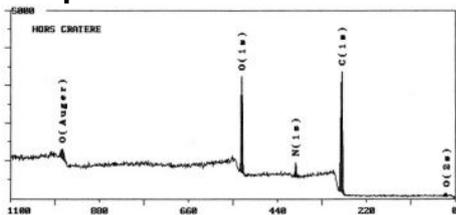


Techniques mises en œuvre : XPS + ToF-SIMS

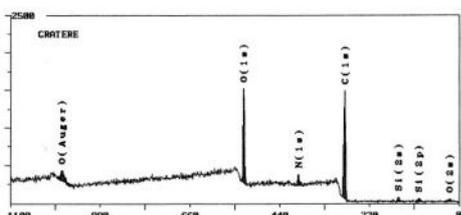
- ✓ XPS : Analyse ponctuelle (taille du cratère < 500 μm) et identification de la nature chimique du contaminant
- ✓ ToF-SIMS : analyse moléculaire d'extrême surface (profondeur sondée : 1-2 nm)

Résultats :

Spectre XPS hors cratère



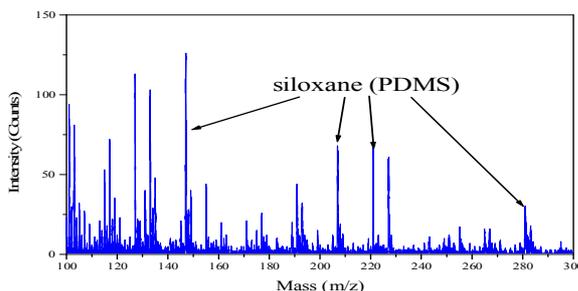
Spectre XPS dans cratère



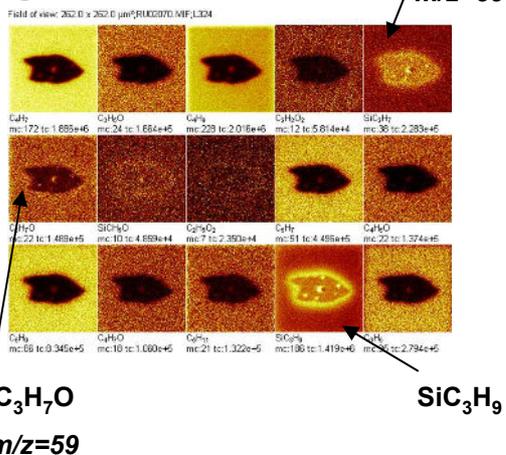
Analyse quantitative

% atomique	C	O	N	Si
Cratère	73	22	3	2
Hors cratère	74	23	3	-

Spectre ToF-SIMS dans cratère



Imagerie ToF-SIMS



Conclusion :

Par XPS : refus d'adhérence par contamination de surface par un composé siliconé
 Par ToF-SIMS : silicone de type PDMS